

2025 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和
所 在 地 京都府向日市森本町東ノ口 1-1
ニデックパーク C 棟

SEMICON SEA 2025 出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2025 年 5 月 20 日(火)～5 月 22 日(木)にシンガポールで開催される「SEMICON SEA 2025」に出展します。



今回の展示会では、半導体業界向けの高度な検査・試験ソリューションの最新製品を紹介します。最先端の半導体ウエハ用光学式 2D/3D 検査装置（Rwi300MK シリーズ）、半導体パッケージ対応導通/短絡検査装置（GATS シリーズ）、AI サーバー向け大型基板電気検査システム（GATS-8360）、AC/DC マルチテスター（R-700 シリーズ）、超高精度検査用プローブピン、半導体ウエハ用検査プローブカードなどのラインナップをそろえています。

さらに、弊社子会社であるニデック SV プローブからは、垂直型、カンチレバー型プローブカードといった主力製品に加え、市場で急成長を遂げているパワー半導体に特化した新たなプロービングソリューションもご紹介いたします。昨年に発売を発表した加圧構造プローブカードと熱電対技術を用いたプローブカードは、電気自動車（EV）、クラウドコンピューティング、再生可能エネルギーの製造などのパワーデバイスに最適なテストソリューションです。当社グループ総力をあげて業界最先端の計測・検査技術を提案いたします。

〈出展概要〉

- ・会期：2025 年 5 月 20 日(火)～5 月 22 日(木)
- ・会場：シンガポール サンズ エキスポ&コンベンションセンター
- ・ブース：1 階 L2421
- ・公式サイト：<https://www.semiconsea.org/>

〈出展内容〉

- ・光学式 2D/3D ウエハバンプ自動検査システム「Rwi300MK シリーズ」
- ・IGBT/SiC モジュール向け絶縁/静特性/動特性検査装置「NATS シリーズ」
- ・半導体パッケージ対応導通/短絡検査装置「GATS シリーズ」
- ・AI サーバー大型基板電気検査システム「GATS-8360」
- ・AC/DC マルチテスター「R-700 シリーズ」
- ・超高精度検査用プローブピン
- ・半導体ウエハ検査用プローブカード